

El Instituto se encuentra ubicado en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja de Sevilla. La dirección postal completa es Avda. Américo Vespucio nº 49, Isla de la Cartuja (41092-Sevilla).



Para llegar al Instituto pueden utilizarse, además de taxis, las líneas de autobuses urbanos circulares C-1 y C-2 que tienen paradas cerca del edificio (Facultad de Comunicación). Estas mismas líneas paran también en la estación de Santa Justa de RENFE por lo que es una buena combinación si llega a Sevilla en AVE. Si desea venir andando desde la zona centro debe hacerlo por el puente de La Barqueta, estando a unos 45 minutos del centro de la ciudad.

Patrocinadores



Este curso de postgrado pretende familiarizar a los asistentes con algunos de los métodos físicos de análisis más utilizados en la actualidad para la caracterización de materiales, en especial de aquellos que están constituidos por capas finas, y de sus superficies. El curso, de carácter intensivo y cinco días de duración, consta de clases teóricas y sesiones prácticas. Estas últimas se desarrollarán con grupos reducidos de alumnos, empleándose para ellos el equipamiento científico disponible en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores.

El contenido y enfoque de los temas y otras actividades del curso son eminentemente prácticos, estando dirigido a científicos e ingenieros especializados en temas de análisis, diagnóstico, investigación en superficies, etc. También se considera especialmente adecuado para alumnos de tercer ciclo relacionados con la temática tratada.

Director

Dr. Juan Pedro Espinós Manzorro

Secretaría

D^a. Margarita Adorna Muñoz

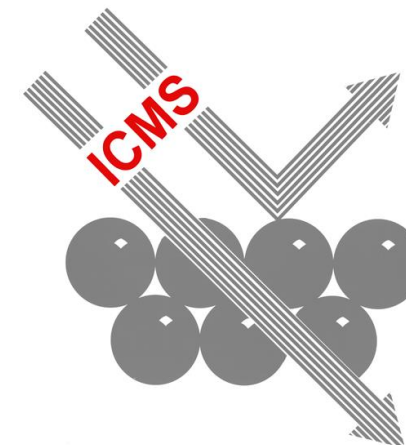
D. José Carlos Rivero

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA
Tfno.: 954489527 – Fax: 954460165
C/ Américo Vespucio, 49 – 41092 SEVILLA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 500 Euros
buzon@icmse.csic.es

(Los estudiantes universitarios de 3er ciclo y excepcionalmente de 2º ciclo que soliciten beca de inscripción deberán presentar curriculum vitae y una carta de presentación de un investigador cualificado)

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA
(CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
"ISLA DE LA CARTUJA")
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
JUNTA DE ANDALUCÍA



MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS

Curso de Postgrado

<http://www.icms.us-csic.es/capasfinas>

Sevilla, del 20 al 24 de Junio de 2022

Lunes, CLASES TEÓRICAS

20 de junio

INTERACCIÓN DE FOTONES, ELECTRONES E IONES CON LA MATERIA CONDENSADA. MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS

Dra. Asunción Fernández

ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN DE RAYOS X: COMPOSICIÓN SUPERFICIAL

Dr. Juan Pedro Espinós

ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN DE RAYOS X: ESTADO QUÍMICO EN LA SUPERFICIE DE SÓLIDOS

Dr. Agustín R. González-Elipe

PÉRDIDA DE ENERGÍA DE ELECTRONES EN SUPERFICIES: PERFILES ELEMENTALES DE COMPOSICIÓN

Dr. Francisco Yubero

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA: UV-VISIBLE-NIR, ELIPSOMETRÍA, COLOR

Dr. Francisco Yubero Valencia

Martes, CLASES TEÓRICAS

21 de junio

MICROSCOPIA DE EFECTO TUNEL

Dr. Juan Ramón Sánchez

PLASMAS EN LA TECNOLOGÍA DE PELÍCULAS DELGADAS

Dr. José Cotrino

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN Y BARRIDO: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES GENERALES

Dra. Asunción Fernández

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

Dra. M^a Carmen Jiménez

ESPECTROSCOPIAS ELECTRÓNICAS: X-EDS y EELS. IMÁGENES FILTRADAS EN ENERGÍA (EFTEM)

Dra. Cristina Rojas

NANOMANIPULACIÓN, PROCESADO Y ANÁLISIS DE PROPIEDADES EN EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

Dra. Ana Borrás

Miércoles, CLASES TEÓRICAS

22 de junio

ANÁLISIS TRIBOLÓGICO Y MECÁNICO DE CAPAS DELGADAS

Dr. Juan Carlos Sánchez

DIFRACCIÓN y REFLECTOMETRÍA DE RAYOS X DE PELÍCULAS DELGADAS

Dr. José M^a Martínez

MICROSCOPIAS DE FUERZAS ATÓMICAS

Dra. Carmen López

CARACTERIZACIÓN ÓPTICA Y VIBRACIONAL DE PELÍCULAS DELGADAS: FLUORESCENCIA, INFRARROJO Y RAMAN

Dr. Angel Barranco.

LA ABSORCIÓN DE RAYOS X, EXAFS Y XANES, DE PELÍCULAS DELGADAS

Dr. Juan Pedro Holgado.

RETRODISPERSIÓN RUTHERFORD: PERFILES DE COMPOSICIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS

Dr. Javier Ferrer

jueves y viernes: PRÁCTICAS 23 y 24 de junio

A. MICROSCOPIAS ELECTRÓNICAS DE TRANSMISIÓN Y BARRIDO

Dra. Cristina Rojas, Dra. M^a Carmen Jiménez., Lda. Olga Montes

B. ESPECTROSCOPIA DE FOTOEMISIÓN, XPS

Dr. Juan Pedro Espinós, Dra. Florencia Vattier

C. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Dr. José M^a Martínez

D. RETRODISPERSIÓN RUTHERFORD

Dr. Javier Ferrer

E. MICROSCOPIA DE FUERZAS ATÓMICAS

Dra. Carmen López, Dr. Juan Ramón Sánchez

F. ABSORCIÓN DE RAYOS X, EXAFS Y XANES

Dr. Juan Pedro Holgado

BOLETIN DE INSCRIPCION

MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS

D.
..... Teléfono
Titulación y Profesión
.....
Centro de Procedencia
.....
Dirección
.....
Email.....

desea inscribirse en el Curso "MÉTODOS FÍSICOS DE ANÁLISIS DE CAPAS FINAS Y SUPERFICIES DE SÓLIDOS", que se celebrará durante los días del 20 al 24 de Junio de 2022

Forma de pago:

Ingreso o transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES2300494510312910002156 SWIFT CODE BSCHES MM del Banco de Santander, a favor del CSIC (CIC- Cartuja) indicando en observaciones el nombre del solicitante y del Curso
Referencia (Adjuntar copia)

Solicita beca como estudiante y adjunta un "currículum vitae" y una carta de presentación de un investigador cualificado.

FIRMA:

Plazo límite de inscripción: **10 de junio de 2022**
Cuota de inscripción: 500 Euros